CALIBRACION INSTRUMENTAL EXACTA

LABORATORIO DE CALIBRACION SUCURSAL SILAO

CARTA DE TRAZABILIDAD DIMENSIONAL SUCURSAL SILAO

CALIBRACIÓN INSTRUMENTAL EXACTA

PATRÓN NACIONAL DE LONGITUD
CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA
LABORATORIO PRIMARIO EN MÉXICO

PATRÓN NACIONAL DE LONGITUD DE ALEMANIA
PHYSIKALISCH TECHNISCHE BUNDESANSTALT (PTB)
LABORATORIO PRIMARIO EN ALEMANIA

CIO
LABORATORIO SECUNDARIO
ACREDITACIÓN: D-85

CIE
LABORATORIO SECUNDARIO
ACREDITACIÓN: D-63

PARALELAS ÓPTICAS

INF: CIO-IC-073/2013
VENCE: PERMANENTE
INC: ± 0.020 µm

PLANTILLA DE AMPLIFICACIÓN
INF: CNM-CC-740-489/2013
VENCE: PERMANENTE
INC: de 0.01 línea/mm a ± 11 línea/mm

ESCALA DE CRISTAL
INF: CNM-CC-740-598/2024
VENCE: DIC-28
INC: $\pm \sqrt{(0.39+2.6*10^{-3*}L^2)}$µm

PLANTILLA ANGULAR
INF: CNM-CC-740-591/2024
VENCE: NOV-28
INC: ± 1.0 ‘(de arco)

NIVELES ELECTRÓNICOS
INF: CNM-CC-740-636/2024
VENCE: DIC-28
INC: ± 0.20 “

MAQUINA DE MEDICION POR COORDENADAS

INF: 252297
VENCE: JUL-28
INC:± (0.5 + 0.00080 x L) µm

ACCESORIOS BLOQUES PATRÓN
INF: 224803
VENCE: NOV-25
INC: ± (0.5 + 0.0030 x L) µm

INF: 224804
VENCE: NOV-25
INC: ± (0.5 + 0.0030 x L) µm

MAESTRO LONGITUD FIJA
INF: 252218
VENCE: JUL-28
INC: ± (0.3 + 0.0050 x L) µm

REGLA DE CRISTAL
INF: 240061
VENCE: MAR-27
INC:± (1.5 + 0.017 x L) µm

INF: 252137
VENCE: JUL-28
INC:± (0.20 + 0.0085 x L) µm

CALIBRADOR DE INDICADORES
INF: 252182
VENCE: JUL-28
INC:± (0.5 + 0.010 x L) µm

BLOQUES PATRÓN ESCALONADO
INF: 251468
VENCE: MAR-27
INC: ± (0.4 + 0.00060 x L) µm

BLOQUES PATRÓN ESCALONADO
INF: 252138
VENCE: JUL-28
INC: ± (0.4 + 0.00060 x L) µm

BLOQUES PATRÓN
INF: 250007
VENCE: ENE-28
INC: ± 0.060 µm

INF: 252157
VENCE: JUL-28
INC: ± 0.036 µm

INF: 250008
VENCE: ENE-28
INC: ± 0.20 µm

INF: 252108
VENCE: JUL-28
INC: ±(0.08 + 0.00060 x L) µm

INF: 253267
VENCE: OCT-28
INC: ± (0.04 + 0.0008 x L) µm

INF: 241475
VENCE: ABR-27
INC: ±(0.04 + 0.0008 x L) µm

PATRONES DE ESPESORES
INF: 252139
VENCE: JUL-28
INC:± 0.40 µm

MESA DE PLANITUD
INF: 250388 SI
VENCE: JUL-28
INC: ± 1.9 µm

INDICADOR TIPO PALANCA
INF: 252302
VENCE: JUL-28
INC: ± 0.34 µm

INF: 252385
VENCE: JUL-28
INC: ± 2.3 µm

COMPARADOR ÓPTICO
INF: 250387 SI
VENCE: JUL-28
INC: ± (1.2 + 0.017 x L) µm

ESCUADRA
INF: 250133
VENCE: AGO-28
INC: ± (3.8 + 0.003 x L) µm

ESFERA PATRÓN
INF: 252140
VENCE: JUL-28
INC: ± 0.12 µm

INF: 252141
VENCE: JUL-28
INC: ± (0.30 + 0.002 x L) µm

ANILLOS PATRÓN
INF:
251566; 251567; 251568; 251569; 251570; 251571; 251572; 251573; 251574; 251575; 251576; 251577; 251578; 251579; 251580; 251581; 251582; 251583; 251584; 251585; 251586; 251587; 251588; 251589; 251590; 251591; 251592; 251593; 251594; 251595; 251596; 251597; 251598; 251599; 251600; 251601; 251602; 251603; 251604; 251605; 251606; 251607; 251608;251609; 251610; 251611; 251612; 251613; 251614; 251615; 251616; 251617; 251618; 251619; 251620; 251621; 251622; 251623; 251624; 251625; 251626; 251627; 251628

VENCE: MAY-28

INC: ± (0.37 + 0.0010 x L) µm

Medidores de Espesores de Recubrimiento

Medidores de Espesores Magnéticos

Medidores de Espesores por Ultrasonido

Medidores de Espesores con Indicador

Medición con Maquina de Medición por Coordenadas

Medición con Comparador Óptico

Micrómetros de Exteriores

Micrómetros de Interiores de 2 Superficies de contacto

Micrómetros de Interiores de 3 Superficies de contacto

Calibradores

Comparadores Ópticos y Microscopios de Medición

Indicadores de Vástago Recto

Palpadores Inductivos

Indicadores de Carátula Tipo Palanca

Palpadores Inductivos Tipo Palanca

Medidores de Alturas

Sistemas Verticales de Medición

Mesas de Planitud

Reglas de Rectitud

L: Longitud en mm

Elaboró:

Luis Font Avila
Gerente de Laboratorio

Fecha de Elaboración: OCTUBRE 2025
Fecha de Vencimiento: NOVIEMBRE 2025